

**Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału
w seminarium:**

High-End Scanning Electron Microscopy

Data:

26.06.2024 r.

Miejsce:

IPPT PAN

ul. Pawińskiego 5B

02-106 Warszawa

Aula II piętro

- 1:00 - 1:05 PM Welcome
- 1:05 - 1:25 PM Microstructure of nitrided high entropy alloys
- dr hab. inż. Dariusz Jarząbek
- 1:25 - 2:05 PM ZEISS GEMINI: High Resolution SEM at Ultra-Low kV for True Sample Surface Imaging
- Dr. Kirill A. Atlasov
- 2:05 - 2:20 PM Break
- 2:20 - 3:00 PM ZEISS Crossbeam Laser: Enabling High-End Microscopy and Analytics Workflows
- Dr. Kirill A. Atlasov

Przyjdź, zobacz i posłuchaj. Serdecznie zapraszamy!

